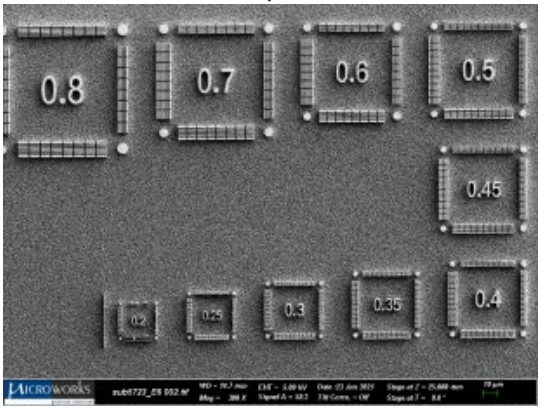
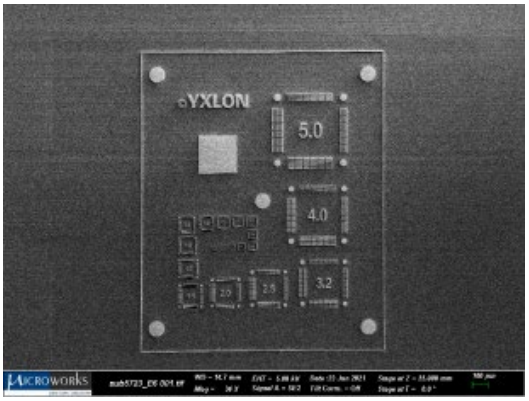
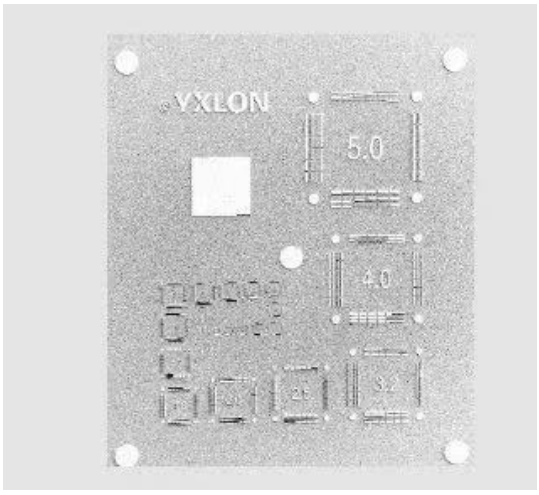
Yxlon标准分辨率测试卡

常规X射线成像很大程度上依靠便捷的工具来评估各检测系统的性能，也就是分辨率测试卡。Yxlon International和Microworks现在已经签署了一项许可协议，Microworks将把与Yxlon International共同开发的分辨率测试卡商业化，并面向全球市场。该分辨率测试卡使用了Microworks在高纵横比精细结构制备上积累多年的X射线光刻经验，提供了17个测试区域，布局如下。可以检测0.3μm到5um的分辨率，并采用了厚度超过3μm的金作为吸收材料，以获得更好的X射线衬度对比。









外形尺寸	8 mm x 8 mm chip size
材料	基底：200 μm硅 吸收体：3 μm高金
线/空间宽度公差	+/- 10%
图案线宽	5.0, 4.0, 3.2, 2.5, 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4, 0.35, 0.3

请联系我们
北京众星联恒科技有限公司
北京市海淀区信息路1号国际创业园西区2号楼1305 电话：+86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com